

JIS

カード及び個人識別用セキュリティデバイス— 試験方法—第1部：一般的特性

JIS X 6305-1 : 2025

(ISO/IEC 10373-1 : 2020 + Amd 1 : 2023)

(JSA)

令和7年8月20日 改正

認定産業標準作成機関 作成・審議

(日本規格協会 発行)

一般財団法人日本規格協会 情報分野産業標準作成委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	渡 邊 創	国立研究開発法人産業技術総合研究所
(委員)	相 蘭 敏 子	株式会社日立製作所
	安 形 輝	亜細亜大学
	島 健 夫	一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会
	寺 田 真 敏	東京電機大学
	中 上 直 子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサル タント・相談員協会
	仲 谷 文 雄	一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会
	永 沼 美 保	日本電気株式会社
	松 田 充 弘	独立行政法人情報処理推進機構
	山 崎 浩 史	総務省国際戦略局

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 15.2.20 改正：令和 7.8.20

担 当 部 署：経済産業省イノベーション・環境局 国際電気標準課

(〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1)

官 報 掲 載 日：令和 7.8.20

認定産業標準作成機関：一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-11-28 三田 Avanti)

素 案 作 成 者：一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-4-10 リーラヒジリザカ)

審 議 委 員 会：情報分野産業標準作成委員会 (委員長 渡邊 創)

この規格についての意見又は質問は、上記認定産業標準作成機関又は素案作成者にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに見直しが行われ速やかに確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義並びに略語	2
3.1 用語及び定義	2
3.2 略語	4
4 試験方法に適用する基本的な事項	4
4.1 試験環境	4
4.2 事前調整	4
4.3 試験方法の選択	4
4.4 既定の公差	4
4.5 総合的な測定不確定性	4
5 試験方法	4
5.1 カードの反り	4
5.2 カードの寸法	5
5.3 剥離強度	7
5.4 カード端部を含む剥離強度	10
5.5 耐化学薬品性	15
5.6 カードの温度及び湿度に対する寸法安定性及び反り	19
5.7 粘着性又は接着性	19
5.8 曲げ強さ	20
5.9 動的曲げ負荷	22
5.10 動的ねじり負荷	26
5.11 不透過度	28
5.12 耐 X 線性	30
5.13 エンボス凸部の高さ	30
5.14 耐熱性	31
5.15 表面のわい（歪）曲，盛上がり，及びへこ（凹）み領域	33
6 ICC の試験方法	33
6.1 外部端子付き ICC の電気計測の規則	33
6.2 外部端子付き ICC の試験装置	33
6.3 外部端子付き ICC の外部端子の寸法及び位置	35
6.4 外部端子の機械的強度	36
6.5 ESD-ICC 外部端子への静電気放電	38
6.6 ESS-PICC 及び VICC の静電気ストレス	38

	ページ
6.7 外部端子付き ICC の外部端子の電気抵抗	40
6.8 静電気の影響に関する追加の試験方法	42
6.9 外部端子付き ICC の外部端子の盛上がり及びへこ（凹）み	42
6.10 ICC—機械的強度：外部端子付き ICC のスリーホイールテスト	43
附属書 A（参考）カードの静電気に対する導電性	49
附属書 B（参考）デバイス帯電モデルに対するカードの ESD 感度	60
参考文献	64
解 説	65

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき、認定産業標準作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS X 6305-1:2010** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

白 紙

カード及び個人識別用セキュリティデバイス— 試験方法—第 1 部：一般的特性

Cards and security devices for personal identification— Test methods—Part 1: General characteristics

序文

この規格は、2020 年に第 3 版として発行された ISO/IEC 10373-1 及び 2023 年に発行された Amendment 1 を基に、技術的内容を変更することなく作成した日本産業規格である。ただし、追補 (amendment) については、編集し、一体とした。

なお、この規格で側線又は点線の下線を施してある参考事項は、対応国際規格にはない事項である。

1 適用範囲

この規格は、JIS X 6301 に従う ID カード及び参考文献[2]～[17]に規定しているような ID カードの試験に関する他の規格の特性の試験方法について規定する。

注記 1 適合基準はこの規格にはなく、参考文献[2]～[17]に記載している他の規格に規定されている。

注記 2 この規格で規定する試験方法は、項目別に行う。1 枚の供試カードを用いて、全ての項目を順番に試験する必要はない。

注記 3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO/IEC 10373-1:2020, Cards and security devices for personal identification—Test methods—Part 1: General characteristics + Amendment 1:2023 (IDT)

なお、対応の程度を表す記号“IDT”は、ISO/IEC Guide 21-1 に基づき、“一致している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版 (追補を含む。) を適用する。

JIS C 61000-4-2 電磁両立性—第 4-2 部：試験及び測定技術—静電気放電イミュニティ試験

注記 1 対応国際規格における引用規格：IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC)—Part 4-2: Testing and measurement techniques—Electrostatic discharge immunity test

注記 2 JIS C 61000-4-2 は、この規格の要求事項の一部を構成していないが、対応国際規格のとおり、引用規格の箇条に記載している。

JIS X 6301 識別カード—物理的特性